
ポスター発表者の方へのご案内

< ポスター発表概要 >

場所：川崎市産業振興会館 4階 企画展示場

日時：2017年9月1日(金) 13:20-14:10, 14:10-15:00

ポスターサイズ：横 90 cm×縦 180 cm 以内

●コアタイムについて

ポスター番号により前後半にコアタイムを分けておりますので、該当時間にはポスター前で説明をお願いします。

I. ポスター番号 偶数 13:20-14:10

II. ポスター番号 奇数 14:10-15:00

※ポスターは分野ごとの配置となり、ポスター番号が採番されています。

ポスター番号は 3・4・5 頁を参照ください。

●ポスター掲示について

必ずコアタイムまでに掲示ください。

ピン等は事務局で用意しています。

※8月31日(木)は13:00から、9月1日(金)は9:15から掲示いただけます。

●ポスター撤収について

ポスター発表終了後(15:00～)、各自ポスターを撤収ください。

ポスター配置図

会場：4階 企画展示場

ポスター発表：9月1日(金)

コアタイム I / 偶数番号

13:20~14:10

コアタイム II / 奇数番号

14:10~15:00

※ポスター撤収 15:00~

機器技術

食品・日用品

P86 H-22 P80 H-07

P87 H-01 P81 J-19

P88 H-02 P82 J-18

P89 H-03 P83 I-05

P90 H-04 P84 I-06

ポスター配置図 P85 I-07

ビームライン

コーヒーコーナー

パンフレット置場

金属・構造材

触媒・電気化学・エネルギー



WC



WC



EV

有機材料

半導体・電子材料

その他

※技術交流会はポスター会場で行います。

NO.	NO.	題名	発表者	所属	研究分野	技術分野	カテゴリ
兵庫県							
P87/H-01	H-01	兵庫県ビームラインBL08B2の現状(Ⅰ)	公立大学法人兵庫県立大学	放射光ナノテクセンター	その他	その他	ビームライン
P88/H-02	H-02	兵庫県ビームラインBL08B2の現状(Ⅱ)	公立大学法人兵庫県立大学	放射光ナノテクセンター	その他	その他	ビームライン
P89/H03	H-03	兵庫県ビームラインBL24XUの現状(Ⅰ)	公立大学法人兵庫県立大学	放射光ナノテクセンター	その他	その他	ビームライン
P90/H-04	H-04	兵庫県ビームラインBL24XUの現状(Ⅱ)	公立大学法人兵庫県立大学	放射光ナノテクセンター	その他	その他	ビームライン
P41/H-05	H-05	Si(111)上にMBE成長したEr ₂ O ₃ /Y ₂ O ₃ 超格子からの斜入射X線回折	尾身 博雄	NTT物性科学基礎研究所	(物質科学・材料科学) その他	X線回折	半導体・電子材料
P05/H-06	H-06	BL24XUにおけるNAP-HAXPESによる自動車用材料の界面状態解析	住田 弘祐	マツダ(株)	無機材料	光電子分光	機器技術
P80/H-07	H-07	毛髪のプローチ処理による細胞膜複合体の変化と水分蒸散の関係	小林 翔	(株)ミルボン	食品・生活用品	X線散乱	食品・日用品
P55/H-08	H-08	マイクロビームSAXS/WAXSによるポリフェニレンサルファイド溶着試験片の界面構造解析	高尾 直樹	(株)日産アーク	その他	その他	有機材料
P25/H-09	H-09	4H-SiC成長結晶のX線トポグラフィ測定	鎌田 功穂	(一財)電力中央研究所	半導体・電子材料	X線イメージング	半導体・電子材料
P53/H-10	H-10	軟・硬X線による機能性有機薄膜の構造解析	東 暹介	(株)住化分析センター	エレクトロニクス	X線・軟X線吸収分光	有機材料
P29/H-11	H-11	cosα法による半導体パッケージ用封止樹脂/銅界面残留応力の冷熱時その場観察	加々良 剛志	住友ベークライト(株)	半導体・電子材料	X線回折	半導体・電子材料
P70/H-12	H-12	In-situ XAFS/SAXS同時測定によるAuナノ粒子生成過程解析	東口 光晴	旭化成(株)	ナノ構造物質	X線散乱、X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P67/H-13	H-13	固体電解質の特性を大きく左右する粒界構造の評価とその制御	額重 温	兵庫県立大学工学研究科	エネルギー・資源	X線回折	触媒・電気化学・エネルギー
P28/H-14 (HO-01)	H-14 (HO-01)	放射光X線散乱法によるSi結晶中の酸素析出物解析	堀川 智之	グロー/ルウェーハズジャパン(株)	半導体・電子材料	X線回折	半導体・電子材料
P56/H-15 (HO-02)	H-15 (HO-02)	フッシュト法ポリエチレン化学発泡成形プロセスのX線イメージング	立石 純一郎	(株)アシックス	食品・生活用品	X線イメージング	有機材料
P60/H-16 (HO-03)	H-16 (HO-03)	放射光を用いた鉄系Li過剰層状正極の充放電挙動解析	弓削 亮太	NEC IoTデバイス研究所	エネルギー・資源	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P03/H17 (HO-04)	H-17 (HO-04)	BL24XUにおけるコヒーレントX線回折を利用したX線ナノイメージング法の開発	高山 裕貴	兵庫県立大学物質理学研究科	その他	X線イメージング	機器技術
P30/H-18	H-18	真空潤滑性を有し耐酸化力を持ったDLC膜の探索とプロセスの解明	神田 一浩	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	無機材料	X線・軟X線吸収分光	半導体・電子材料
P01/H-19	H-19	MeVガンマ線ビームによる非破壊検査と核医学検査への応用	宮本 修治	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	金属・構造材料	その他	機器技術
P51-H-20	H-20	NEXAFSによるインプリント処理された光反応性高分子液晶薄膜の分子配向性評価	春山 雄一	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	有機材料	X線・軟X線吸収分光	有機材料
P02/H-21 (HO-05)	H-21 (HO-05)	NewSUBARUに於ける極端紫外線リソグラフィ技術開発	渡邊 健夫	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	半導体・電子材料	X線・軟X線吸収分光	機器技術
P86/H-22	H-22	NewSUBARU ティープX線リソグラフィビームライン BL11	竹内 雅耶	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	微細加工・照射効果	その他	ビームライン
サンビーム							
P24/S-01	S-01	放射光トポグラフィによるSiC単結晶基板の評価	中村 勇	三菱電機(株)	半導体・電子材料	X線イメージング	半導体・電子材料
P35/S-02 (SO-01)	S-02 (SO-01)	硬X線光電子分光法による酸化膜/Si基板界面の欠陥密度評価	田中 政幸	三菱電機(株)	半導体・電子材料	光電子分光	半導体・電子材料
P33/S-03 (SO-02)	S-03 (SO-02)	IoT市場向け強誘電体メモリ(FRAM)におけるPLZT薄膜の結晶化メカニズム	野村 健二	(株)富士通研究所	半導体・電子材料	X線回折	半導体・電子材料
P36/S-04	S-04	人工光合成用Ga-N-Znナノ粒子アノード電極膜のXAFS/HAXPESによる分析	淡路 直樹	(株)富士通研究所	環境材料	X線・軟X線吸収分光, 光電子分光	半導体・電子材料
P26/S-05	S-05	SiC-MOSFETのX線トポグラフィ評価	小西 くみこ	(株)日立製作所	エレクトロニクス	X線イメージング	半導体・電子材料
P27/S-06 (SO-03)	S-06 (SO-03)	走査型X線顕微鏡を用いたマイクロトポグラフィの検討	米山 明男	(株)日立製作所	産業利用(その他)	X線イメージング	半導体・電子材料
P65/S-07	S-07	全固体電気二重層電界効果による金属薄膜のキャリア濃度の変調、及び、その非線形動的挙動	浅野 哲也	パナソニック(株)	表面界面物性	光電子分光	触媒・電気化学・エネルギー
P61/S-08	S-08	燃料電池用新規アノード触媒のXAFSによるCO吸着解析	矢野 啓	山梨大学	電気化学	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P64/S-09	S-09	HAXPESを用いたLiイオン電池におけるSi系負極の表面分析	高橋 伊久磨	日産自動車(株)	電気化学	光電子分光	触媒・電気化学・エネルギー
P37/S-10	S-10	InGaN/GaN量子井戸における下地基板の影響評価	榊 篤史	日亜化学工業(株)	半導体・電子材料	X線・軟X線吸収分光	半導体・電子材料
P38/S-11	S-11	サファイア層に埋もれた界面のX線回折測定	宮野 宗彦	日亜化学工業(株)	半導体・電子材料	X線回折	半導体・電子材料
P71/S-12	S-12	SR-XRFによる微量貴金属の分析	小坂 悟	(株)豊田中央研究所	触媒化学	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P52/S-13	S-13	HAXPESによるトライボ表面の分析	高橋 直子	(株)豊田中央研究所	環境材料	光電子分光	有機材料
P39/S-14	S-14	サーファクタント効果利用MOCVD成長GeSn薄膜のHAXPES解析	白田 宏治	(株)東芝	半導体・電子材料	光電子分光	半導体・電子材料
P31/S-15	S-15	次世代磁気抵抗メモリ向けタンダステン薄膜の局所構造解析	藤井 景子	(株)東芝	半導体・電子材料	X線・軟X線吸収分光	半導体・電子材料
P62/S-16	S-16	リチウムイオン二次電池負極上の正極溶出物質のXAFS解析	盛本 さやか	(株)東芝	電気化学	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P19/S-17	S-17	Ni基超合金の変形挙動に及ぼすγ/γ'微視組織の影響	向井 康博	関西電力(株)	金属・構造材料	X線回折	金属・構造材
P72/S-18	S-18	XAFSによる微量元素の化学形態分析	山本 融	(一財)電力中央研究所	エネルギー・資源	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P63/S-19	S-19	リチウムイオン二次電池LiCoO ₂ 正極のXAFS解析	稲葉 雄大	ソニー(株)	電気化学	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P50/S-20 (SO-04)	S-20 (SO-04)	硬X線光電子分光による金属/高分子界面の密着機構の調査	久保 優吾	住友電気工業(株)	産業利用(その他)	光電子分光	有機材料
P42/S-21	S-21	その場X線回折による薄膜中ナノ結晶成長過程の観測	豊島 遼	住友電気工業(株)	半導体・電子材料	X線回折	半導体・電子材料
P22/S-22	S-22	HAXPESを用いたAl合金表面の改質と変質挙動の評価	北原 周	(株)コベルコ科研	金属・構造材料	光電子分光	金属・構造材

NO.	NO.	題名	発表者	所属	研究分野	技術分野	カテゴリ
P21/S-23	S-23	XAFSを用いた鋼材腐食過程における添加元素の影響評価	横溝 臣智	(株)コベルコ科研	金属・構造材料, 電気化学	X線・軟X線吸収分光	金属・構造材
P78/S-24	S-24	排ガス浄化触媒のin-situ XAFS評価	中山 耕輔	川崎重工業(株)	触媒化学	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P20/S-25 (SO-05)	S-25 (SO-05)	耐熱合金表面の酸化生成挙動の評価	根上 将大	川崎重工業(株)	金属・構造材料	X線回折	金属・構造材
P08/S-26	S-26	X線・中性子線反射率解析ソフトウェアAXRef	土井 修一	(株)富士通研究所	半導体・電子材料	X線散乱	機器技術
P07/S-27	S-27	サンビームによるX線異常分散回折測定技術の開発(2)	徳田 一弥	住友電気工業(株)	産業利用 (その他)	X線回折	機器技術
P06/S-28	S-28	サンビームでのXAFS 測定環境の整備	黒岡 和巳	パナソニック(株)	産業利用 (その他)	X線・軟X線吸収分光	機器技術
JASRI共用ビームライン実施課題							
P11/J-01	J-01	回折コントラストモグラフィー・インライン計測による疲労損傷評価	中井 善一	神戸大学	金属・構造材料	X線イメージング	金属・構造材
P13/J-02	J-02	X線CTおよびX線回折連成によるセメントと岩の相互作用の解析	人見 尚	(株)大林組	無機材料	X線イメージング	金属・構造材
P54/J-03	J-03	In-situ 小角散乱法によるアルキルベンダント型ポリマー結晶構造の温度依存性評価	森 文哉	ライオン(株)	有機材料	X線散乱	有機材料
P69/J-04	J-04	燃料電池用高活性ナノ粒子触媒モデルとしての白金/ルテチウム合金単結晶電極	須田 耕平	山梨大学	エネルギー・資源	X線散乱	触媒・電気化学・エネルギー
P16/J-05	J-05	エネルギー分散型X線回折法を用いたAl多結晶材の結晶粒および粒界近傍における局所応力分布解析	櫻庭 光隆	東京工業大学大学院	金属・構造材料	X線回折	金属・構造材
P74/J-06	J-06	バイオマス由来有機酸の高度利用を指向したハイドロキシアパタイト固定化Pt-MoO ₃ 触媒のXAFS解析	金田 清臣	大阪大学	触媒化学	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P23/J-07	J-07	放射光を利用した産業課題解決の一例：自動車タイヤ	小澤 健一	東京工業大学	金属・構造材料	光電子分光	金属・構造材
P45/J-08	J-08	2D-GIXDによる有機半導体薄膜のin situ 構造評価	吉本 則之	若手大学	半導体・電子材料	X線回折	有機材料
P12/J-09	J-09	X線イメージングによる石炭/コークスの3次元内部構造解析	西原 克浩	新日鐵住金(株)	無機材料	X線イメージング	金属・構造材
P18/J-10	J-10	異常小角X線散乱法による高温超電導線材中の人工ピンの解析	佐々木 宏和	古河電気工業(株)	超伝導材料	X線散乱	金属・構造材
P34/J-11	J-11	PEEMによる積層セラミックコンデンサにおけるチタン酸バリウムの変質メカニズム調査	村木 智則	(株)村田製作所	エレクトロニクス	光電子分光	半導体・電子材料
P17/J-12	J-12	超微細粒Cu-Fe合金におけるFe析出粒子の焼鈍に伴うサイズ変化の小角散乱法による測定	宮澤 知孝	東京工業大学	金属・構造材料	X線散乱	金属・構造材
P76/J-13	J-13	金属酸化物担持金クラスター触媒調製におけるマイクロ波乾燥効果	竹歳 純子	首都大学東京	触媒化学	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P10/J-14	J-14	放射光X線ラミログラフィによる転動疲労損傷の4D観察	牧野 泰三	新日鐵住金(株)	金属・構造材料	X線イメージング	金属・構造材
P46/J-15	J-15	有機鉛ペロブスカイト結晶形成過程のリアルタイム解析	宮寺 哲彦	国立研究開発法人産業技術総合研究所	エネルギー・資源	X線回折	有機材料
P59/J-16	J-16	タンタルの溶融塩電解回収を目指す条件最適化に向けた高温in situ XAFS測定	篠田 弘造	東北大学	産業利用 (その他)	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P32/J-17	J-17	超伝導デバイス用パフア層としてのCeO ₂ 薄膜の斜入射X線回折による結晶性評価	深野 達雄	(株)豊田中央研究所	無機材料	X線回折	半導体・電子材料
P82/J-18	J-18	保管中に温度変動を与えた冷凍バスタの組織形状の変化の観察	野中 純子	日清製粉グループ本社 基礎研究所	食品・生活用品	X線イメージング	食品・日用品
P81/J-19	J-19	日本酒の劣化臭吸着剤実用化のための担持金ナノ粒子調製条件の検討	村山 美乃	九州大学大学院理学研究院	食品・生活用品	X線・軟X線吸収分光	食品・日用品
P48/J-20	J-20	マイクロビームX線を用いたコンビナトリアル有機薄膜ラブリアのGI-WAXSマッピング	丸山 伸伍	東北大学	有機材料	X線回折	有機材料
P47/J-21	J-21	微小角入射広角X線散乱法を用いた液晶性フタロシアニン配向薄膜の三次元構造解析	大森 雅志	大阪大学	有機材料	X線回折	有機材料
P40/J-22	J-22	高Sn濃度Ge _{1-x} Sn _x 膜の新規成膜手法としてのSbサーファクタント効果の活用	須田 耕平	明治大学	半導体・電子材料	X線回折	半導体・電子材料
P14/J-23	J-23	非破壊CT-XRD連成法を用いた高温作用を受けたセメント硬化体の観察	高橋 駿人	北海道大学	産業利用 (その他)	X線イメージング	金属・構造材
豊田中央研究所							
P77/T-01	T-01	排気浄化触媒リアクターの時間-空間分解解析	高木 秀樹	(株)豊田中央研究所	触媒化学	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P15/T-02	T-02	走査型3DXRD法による結晶方位マッピングの検証 ~SPCC材の粒径評価~	林 雄二郎	(株)豊田中央研究所	金属・構造材料	X線回折	金属・構造材
P44/T-03	T-03	時分割広角X線散乱法による樹脂の重合・結晶化プロセス解析	成田 麻美子	(株)豊田中央研究所	有機材料	X線散乱	有機材料
P66/T-04	T-04	リチウムイオン電池の充電黒鉛負極の昇温XRD解析	野中 敬正	(株)豊田中央研究所	電気化学	X線回折	触媒・電気化学・エネルギー
P68/T-05	T-05	固体酸化物燃料電池の電極解析	松尾 秀仁	(株)豊田中央研究所	無機材料	X線回折	触媒・電気化学・エネルギー
P75/T-06	T-06	PtレスPEFC用ポリオキソメタレート水溶液のredox種の同定	畑中 達也	(株)豊田中央研究所	エネルギー・資源	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
P79/T-07	T-07	排ガス浄化用触媒層の細孔特性が層内ガス流れに及ぼす影響	加藤 悟	(株)豊田中央研究所	触媒化学	X線イメージング	触媒・電気化学・エネルギー
P73/T-08	T-08	β-FeOOH電気化学触媒のXAFS解析	野中 敬正	(株)豊田中央研究所	電気化学	X線・軟X線吸収分光	触媒・電気化学・エネルギー
FSBL (フロンティアソフトウェア)							
P57/F-01	F-01	シリコン系材料に対するX線光子相関分光法によるダイナミクス測定	西田 理彦	住友化学(株)	ソフトマテリアル物性	X線散乱	有機材料
P58/F-02	F-02	カラーフィルター用インキの粉体、液体、塗膜における顔料凝集構造の小角散乱法による解析	小池淳一郎	DIC(株)	ソフトマテリアル物性	X線散乱	有機材料
JASRI産業利用推進室							
P49/I-01	I-01	硬X線光電子分光法を用いた有機薄膜トランジスタ動作中における電位分布の観察	渡辺 剛	(公財)高輝度光科学研究センター	半導体・電子材料	光電子分光	有機材料
P43/I-02	I-02	微小角入射X線小角散乱によるペンタセン薄膜の表面形態評価	廣沢 一郎	(公財)高輝度光科学研究センター	有機材料	X線散乱	有機材料
P09/I-03	I-03	BL28B2における高エネルギーX線イメージング	梶原 堅太郎	(公財)高輝度光科学研究センター	産業利用 (その他)	X線イメージング	機器技術
P04/I-04	I-04	BL46XUにおける硬X線光電子分光 (HAXPES) 装置の現状	安野 聡	(公財)高輝度光科学研究センター	産業利用 (その他)	光電子分光	機器技術

